製品仕様書

Specification of Crystal Unit

決定年月日 Issue Date : June 2, 2023

1. 品番 Part Number

当 社 品 番 Murata Part Number

XRCGB40M000F1S2AR0 (Frequency: 40.0000MHz / Size: 2.0 x 1.6mm)

2. 適 用 Scope

当製品仕様書は、マイクロコンピュータ等のクロック発生回路に使用する水晶振動子について規定します。この用途以外にご使用の場合には事前に当社へご連絡ください。

This product specification is applied to the crystal unit used for time base oscillator in a microcomputer. Please contact us when using this product for any other applications than described in the above.

3. 外観 及び 寸法 Appearance and Dimensions

3-1 外観: 目視によって表示識別可能であり、汚れ等がありません。

Appearance : No illegible marking. No visible dirt.

3-2 外形寸法図 : 製品単体の形状を項目6に示します。

Dimensions of component : Please refer to item 6 for component dimensions.

3-3 構造 : アルミナ基板に、水晶素子を接着し、金属キャップで蓋

をしております。

Construction : Crystal element is mounted onto alumina substrate,

then metal cap covers over the element.

4. 定格 Rating

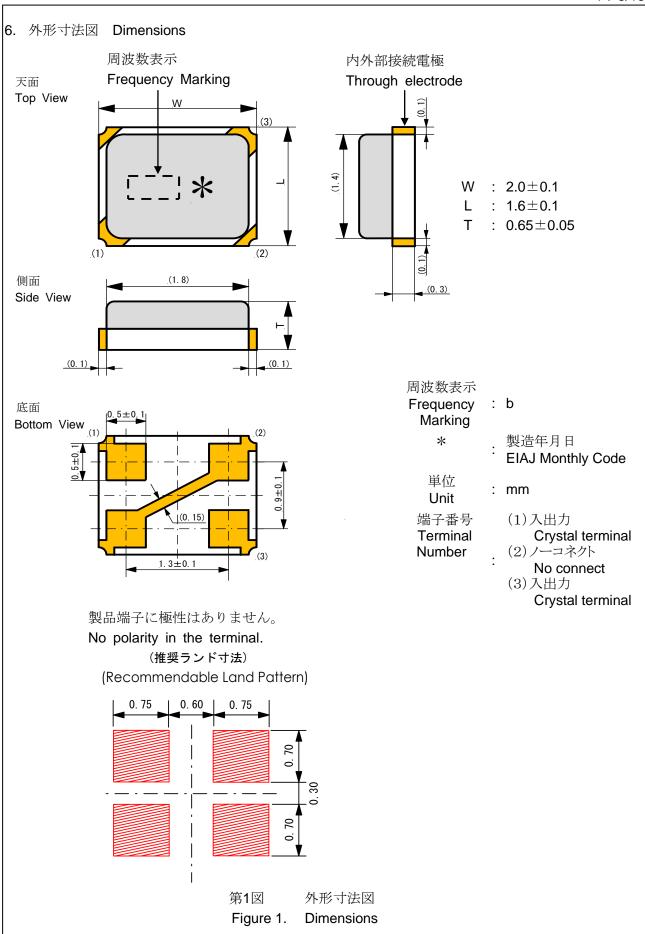
	項 目 Item	規格 Specification	
4-1	動作温度範囲	-30 to +85°C	
	Operating Temperature Range	-30 to +65 C	
4-2	保存温度範囲	-55 to +85°C	
	Storage Temperature Range	-55 to +65 C	
4-3	励振レベル	200 MNT/	
	Drive Level	300 μ W以下/max.	
4-4	直流印加電圧	D.C.6V 以下/max.	
	D.C. Voltage	D.C.ov 以下inax.	
4-5	入力信号振幅	15\/n n □ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	A.C. Voltage	15Vp-p 以下/max.	
4-6	耐電圧	D.C. 400V PLE/may Fo PUE/may	
	Withstanding Voltage	D.C. 100V 以下/max. 5s 以内/max.	

5. 電気的性能 Electrical Characteristics

	項 目 Item	規格 Specification		
5-1	公称周波数	40 0000MHz		
	Nominal Frequency	40.0000MHz		
5-2	周波数許容偏差 *1	±10ppm 以内/max.		
	Frequency Tolerance *1	土 Toppin 以内innax.		
5-3	周波数温度依存性	±10ppm 以内/max. (-30 to +85°C)		
	Frequency Shift by Temperature	(初期値に対し/from initial value)		
5-4	周波数エージング *1	±2ppm 以内/年		
	Frequency Aging *1	max./year		
5-5	等価直列抵抗 *1	50Ω 以下/max.		
	Equivalent Series Resistance *1	30 ½ 以↑/IIIax.		
5-6	絶縁抵抗 *2	500MΩ 以上/min. (D.C.10V 印加時)		
	Insulation Resistance *2	(Applied D.C.10V)		
5-7	負荷容量 (Cs) *1	12.0°E		
	Load Capacitance *1	12.0pF		
5-8	端子間容量 (C ₀)	1 Opt NIE/may		
	Shunt Capacitance (C ₀)	1.0pF 以下/max.		

- *1 周波数および等価直列抵抗の測定方法は8項を参照ください。 Please refer item 8 for measuring method of frequency and Equivalent Series Resistance.
- *2 端子相互間での抵抗を示します。

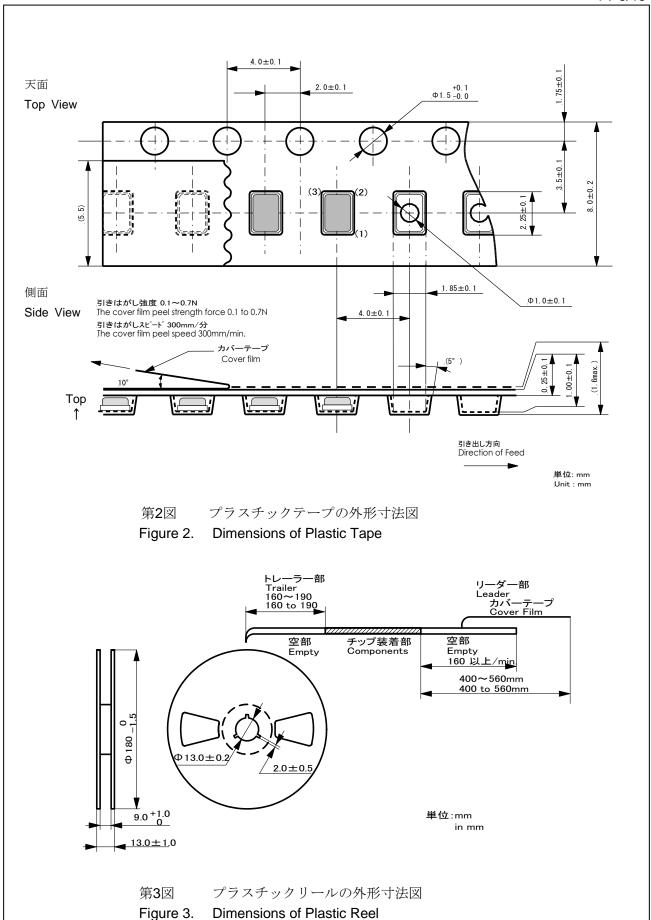
This characteristic shows the resistance between terminals.



	月 Month	1	9	2	4	F	G	7	0	0	1.0	11	10
年 Year		1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	11	12
2011, 2015, 2019,	2023	а	b	c	d	Ф	f	g	h	j	k	ℓ	m
2012, 2016, 2020,	2024	n	p	8	r	Q	t	u	U	w	x	¥	3
2013, 2017, 2021,	2025	Α	В	С	D	E	F	G	Н	J	K	L	M
2014, 2018, 2022,	2026	N	P	Q	R	s	Т	U	V	w	X	Y	Z

製造年月度 / EIAJ Monthly Code

- (注) 4年で1サイクルとなります。 / (note) The number is cycled by 4years.
- 7. テーピング品包装規格 Packaging Standard (Taping)
 - 7-1 テープは右巻き(テープの端を手前に取り出した時、送り穴が右側になる向き)とします。 The tape for components shall be wound clockwise. The feeding holes shall be to the right side as the tape is pulled toward the user.
 - 7-2 チップは、1リール 3,000個収納します。 A reel shall contain 3,000pcs of components.
 - **7-3** プラスチックテープの外形寸法図を第2図に示します。 Dimensions of plastic tape are shown in Figure 2.
 - **7-4** プラスチックリールの外形寸法図を第**3**図に示します。 Dimensions of plastic reel are shown in Figure 3.



8. 測定方法 Measuring Method

8-1 周波数測定方法:

5、9、10項で示す周波数は、第4-1図で示す回路とネットワークアナライザ(S&A 250Bもしくは相当品)にて測定した負荷共振周波数を示します。測定機器の違いにより、周波数ズレが発生する可能性があります。

Frequency measuring method:

Frequency which is mentioned in item 5, 9 and 10 means the load resonance frequency measured by network analyzer (S&A 250B or the equivalent) and the circuit in Figure. 4-1. Measured frequency may be changed by using different measurement equipment.

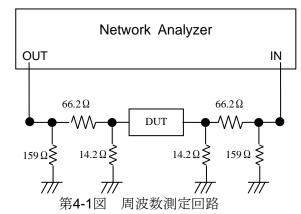


Figure 4-1 Frequency measuring circuit

8-2 等価直列抵抗 : 5項に示す等価直列抵抗(ESR)は、第4-1図で示す回路と

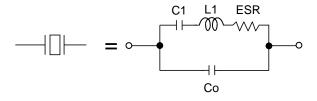
ネットワークアナライザ(S&A 250Bもしくは相当品)に

て測定します。DUTは第4-2図に示します。

Equivalent series resistance : The equivalent series resistance (ESR) which is men-

tioned in item 5 is measured by network analyzer (S&A 250B or equivalent) and the circuit in Figure. 4-1. DUT is

shown in Figure 4-2.



第4-2図 DUT(被測定デバイス) Figure 4-2 DUT(Device Under Test)

8-3 測定条件 : 温度+30±0.5℃、湿度25~75%R.H.を標準測定状態とし

ます。

Measuring Condition : Standard conditions for the measurement shall be

+30+0.5°C and 25 to 75%R.H.

8-4 周波数エージング : 温度+25±2°C、湿度60±2%R.H.環境下での5年の変動量

予測値から年あたりの変動量を算出します。

Frequency aging : Frequency aging is calculated aging value from the aver-

age of frequency drift in 5 years under +25±2°C and

60±2%R.H.

幾械的	勺性能 Physica	I Characteristics
\	項目	試験条件 試験後の規格
	Item	Test Condition Specification
	item	After Test
9-1	落下	製品を模擬治具(荷重負荷120g)に取り付けた外観に異常がなく
		状態で、1.5mの高さからコンクリートに6方向各表1を満足します。
		10回自然落下させた後、測定します。
	Drop	Component with 120g dummy housing shall be No visible dama
		measured after drops in 6 perpendicular and the measur
		directions, total 60 times, onto a concrete floor values shall me
		from a height of 1.5m. Table 1.
9-2	正弦波振動	製品を試験用基板に実装した状態で、振動周波数表1を満足します。
		10~55Hz、全振幅1.5mmの振動をX,Y,Zの3方向
		に各2時間加えた後、測定します。試験方法は
		IEC60068-2-6に準拠に準拠します。
	Vibration	Component shall be soldered on the test board. The measured value
	(Sinusoidal)	Then it shall be measured after being applied shall meet Table 1.
		vibration of amplitude 1.5mm and vibration
		frequency 10 to 55Hz to each of 3 perpendicular
		directions for 2 hours. Testing procedure is in
		accordance with IEC60068-2-6.
9-3	基板たわみ	下図に示すたわみ試験用基板に実装し、矢印の方表1を満足します。
		向に5回たわませた後、測定します。
		たわみ量:1mm 保持時間:1秒
		基板厚み:1.6mm
	Board Flex	Component shall be soldered on the test board. The measured value
		Then it shall be measured after being applied shall meet Table 1.
		pressure in vertical direction shown in the figure
		below for 5 times until the bent width reaches
		1mm and hold for 1 second. (PCB thickness:
		1.6mm)
		加圧棒 20 ^{Stick} 10 Load
		20 10
		PCB tabih
		R10 Deflection
		φ 5支持台 部品 コキャンターズレ Part Part Off-Center
		45 45
		100

Component mounted / 素子実装部

単位/Unit: mm

9-4	はんだ耐熱	製品単品状態でリフロー炉(ピーク温度+260±	表 1 を満足します。
	(1)リフロー方式	5℃、5.0±0.5秒、その他条件は12-7-2項を参	
		照)に2回通した後、室温に取り出し、24時間放	
		置した後、測定します。試験方法はIEC60068-2-	
		58に準拠します。	
	Resistance to	Component shall be measured after 2 times	The measured values
	Soldering Heat	reflow soldering and leaving at room temperature s	shall meet Table 1.
	(1)Re-flow	for 24 hours. For soldering profile, refer to item	
	Soldering	12-7-2 (Peak temperature is +260±5°C for	
		5.0±0.5s). Testing procedure is in accordance	
		with IEC60068-2-58.	
	(2)コテ付け方式	PCB上にて温度+350±5°Cで5.0±0.5秒間はんだり	外観に異常がなく、
		付けを行い、室温に24時間放置した後、測定し	表 1 を満足します。
		ます。但し、はんだこて先は電極部に直接接触し	
		ない事とします。試験方法はIEC60068-2-58に準	
		拠します。	
	(2)Soldering	Component shall be measured after soldering on	No visible damage
	with iron	PCB at +350±5°C for 5.0±0.5s and leaving at	•
		room temperature for 24 hours. The soldering	
		iron shall not touch the component while	
		soldering. Testing procedure is in accordance	
		with IEC60068-2-58.	
9-5	はんだ付性	無鉛はんだ (Sn-3.0Ag-0.5Cu)	端子の90%以上には
		PCT装置にて温度+105℃ 、湿度100%R.H.の条	んだが付着します。
		件で、4時間のエージングをした後、端子部分を	
		ロジンメタノール液に5秒浸した後、 +245 ±5℃	
		の溶融はんだ中に3.0±0.5秒間浸します。試験方	
		法はIEC60068-2-58に準拠します。	
	Solderability	Lead free solder (Sn-3.0Ag-0.5Cu)	Ninety (90) % or more
		After being kept in pressure cocker at +105°C	of terminal surface
		and 100%R.H. for 4 hours, and being placed in a	shall be coated with
		rosin-methanol for 5s, the terminals of s	solder.
		component shall be immersed in a soldering bath	
		at +245±5°C for 3.0±0.5s. Testing procedure is in	
		accordance with IEC60068-2-58.	

10. 耐候性能 Environmental Characteristics

			試験後の規格
	項目	試 験 条 件	Specification
	Item	Test Condition	After Test
10-1	高温放置	- 製品を試験用基板に実装した状態で、温度+85±2°C	
		の恒温槽中に1000時間保持した後、室温に取り出	
		し、24時間放置した後、測定します。試験方法は	
		IEC60068-2-2に準拠します。	
	High	Component shall be soldered on the test board. Then	The measured values
		it shall be kept in a chamber at +85±2°C for 1000	
	Exposure	hours. And then it shall be measured after leaving at	
	(Storage)	room temperature for 24 hours. Testing procedure is	
	·	in accordance with IEC60068-2-2.	
10-2	低温放置	製品を試験用基板に実装した状態で、温度-55±2°C	表 1 を満足します。
		の恒温槽中に1000時間保持した後、室温に取り出	
		し、24時間放置した後、測定します。試験方法は	
		IEC60068-2-1に準拠します。	
	Cold	Component shall be soldered on the test board. Then	The measured values
	(Storage)	it shall be kept in a chamber at -55±2°C for 1000	shall meet Table 1.
		hours. And then it shall be measured after leaving at	
		room temperature for 24 hours. Testing procedure is	
		in accordance with IEC60068-2-1.	
10-3	高温高湿放置	製品を試験用基板に実装した状態で、温度+60±2°C	表1を満足します。
		湿度90~95%R.H.の恒温恒湿槽中にて1000時間保持	
		した後、室温に取り出し、24時間放置した後、測定	
		します。試験方法はIEC60068-2-78に準拠します。	
	Humidity	Component shall be soldered on the test board. Then	The measured values
		it shall be kept in a chamber at +60±2°C, 90 to	
		95%R.H. for 1000 hours. And then it shall be	
		measured after leaving at room temperature for 24	
		hours. Testing procedure is in accordance with	
		IEC60068-2-78.	
10-4	熱衝撃	製品を試験用基板に実装した状態で、温度-55°Cの恒	· · · · ·
		温槽中に30分間保持後、温度+85℃の恒温槽中に直	
		ちに移し、30分間保持する。これを1サイクルとし、	
		10サイクル行った後、室温に取り出し、24時間放置	
		した後、測定します。試験方法はIEC60068-2-14に準	
	T	拠します。	The mean and walling
	·	Component shall be soldered on the test board. After	
	Cycling	performing 10 cycles of thermal test (-55°C for 30	
		minutes to +85°C for 30 minutes), it shall be	
		measured after leaving at room temperature for 24	
		hours. Testing procedure is in accordance with IEC60068-2-14.	
		IEC00000-2-14.	

表1	Table 1.
周波数変動量	±25ppm 以内 (初期値に対し)
Frequency deviation	\pm 25ppm max. (from initial value)

11. 🗥 注意 Cautions

11-1 用途の限定 Limitation of Applications

当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがある等の理由により、高信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に当社までご連絡下さい。ただし、⑥の輸送機器は、機器の動作に直接かかわる用途でのご使用は避けてください。(具体例:エンジン制御、ブレーキ制御、ステアリング制御、ボディ制御)

- ①航空機器 ②宇宙機器 ③海底機器 ④発電所制御機器 ⑤医療機器
- ⑥輸送機器(自動車、列車、船舶等) ⑦交通用信号機器 ⑧防災/防犯機器
- ⑨情報処理機器 ⑩その他上記機器と同等の機器

Please contact us before using our products for the applications listed below which require especially high reliability for the prevention of defects which might directly cause damage to the third party's life, body or property.

Notice, please do not use this products in following applications in transportation equipment. (example: engine control, brake control, steering control, body control)

- ①Aircraft equipment
- ②Aerospace equipment
- 3 Undersea equipment
- 4 Power plant control equipment
- **5**Medical equipment
- ⑥Transportation equipment(vehicles, trains, ships, etc.)
- 7 Traffic signal equipment
- ®Disaster prevention / crime prevention equipment
- 9 Data-processing equipment

11-2 フェールセーフ機能の付加 Fail-safe

当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加して下さい。

Be sure to provide an appropriate fail-safe function on your product to prevent a second damage that may be caused by the abnormal function or the failure of our product.

12. 使用上の注意 Caution for Use

12-1

過大な機械衝撃が印加された場合、不具合を生じることがありますので取り扱いには充分ご 注意下さい。

The component may be damaged if excess mechanical stress is applied.

12-2

当製品は気密構造ではありません。洗浄及び樹脂コーティングの使用は保証しておりません。外装樹脂コーティングが必要な場合には電気的特性、機械的特性に影響を与えない適切な樹脂を選択して頂き製品に実装された状態でご評価の上、ご使用下さい。

Conformal coating or washing to the component is not guaranteed. Because it is not hermetically sealed. In case you need to use a coating material, please select the suitable one which does not affect both electrical and mechanical characteristics. And please make sure that your product has been evaluated in view of your specifications with our product being mounted to your product.

12-3

ご使用IC及び発振回路条件により、発振不具合(異常発振あるいは発振停止)が発生する場合がありますので、回路条件を充分ご確認の上ご使用下さい。

Please confirm the circuit conditions on your set, because irregular or stop oscillation may occur under unmatched circuit conditions.

12-4

当製品は、画像認識タイプの位置決め機構実装機に対応しています。但し、実装条件によっては過大な衝撃が加わり製品本体を破損する場合がありますので事前に使用される実装機で必ず評価確認をして下さい。なお、メカチャック機構タイプの実装機での実装は避けて下さい。詳細については事前に当社までお問い合わせ下さい。

The component is recommended with placement machines employing optical placement capabilities. The component might be damaged by mechanical force depending on placement machine and condition. Make sure that you have evaluated by using placement machines before going into mass production. Do not use placement machines employing mechanical positioning. Please contact Murata for details beforehand.

12-5

実装後に基板から取り外した製品は再使用しないで下さい。

Do not reuse components once mounted onto a circuit board.

12-6

基板最上面のグランドや信号パターンは水晶振動子の下部に配置しないよう注意して下さい。 Ground or signal path on the top of substrate should not be located underneath crystal unit.

12-7 はんだ付けに関する注意事項 Caution for Soldering

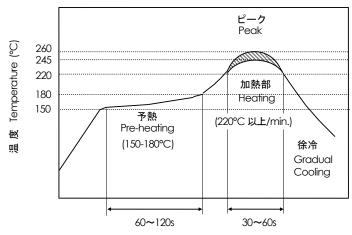
この製品はリフロー方式で実装をお願いします。

Please mount components on a circuit board by the re-flow soldering

12-7-1 推奨するフラックスおよびはんだ Recommendable Flux and Solder

フラックス	ロジン系フラックスをお使いください。水溶性フラックスは使用しないでください。
Flux	Please use rosin based flux, but do not use water soluble flux.
はんだ Solder	Sn-3.0Ag-0.5Cu組成のはんだをご使用ください。 クリームはんだ塗布厚は、0.10~0.15mmの範囲でお願いします。 Please use solder (Sn-3.0Ag-0.5Cu) under the following condition. Standard thickness of soldering paste: 0.10 to 0.15mm

12-7-2 推奨はんだ条件 Recommendable Soldering Profile



	標準プロファイル
	Standard soldering profile
予熱	150°C to 180°C
Pre-heating	60s to 120s
加熱部	220°C 以上/min.
Heating	30s to 60s
ピーク温度	245°C以上/min. 260°C以下/max.
Peak temperature	5s 以内/max.

^{*}温度は部品表面付近で測定します。

^{*}Temperature shall be measured on the surface of component.

12-7-3 こて付け条件 Reworking with soldering iron

やむを得ずはんだこてを使用して製品をはんだ付け・修正する場合は、以下の点に注意して行って下さい。

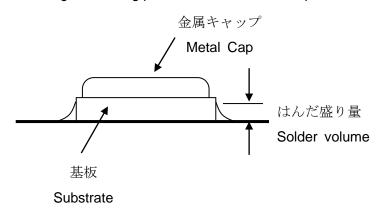
Please solder with soldering iron noting to the following conditions.

	条件		
	condition		
予熱温度	150°C 60s		
Pre-heating	130 C 008		
はんだこてのこて先温度	350°C 以下/max.		
Heating of the soldering iron	350 C 🔊 /IIIax.		
はんだこてのワット数	30W 以下/max.		
Watt	3311 31 111111111		
はんだこてのこて先形状	φ3mm 以下/max.		
Shape of the soldering iron	φ σπιπ » γ γπιαχ.		
はんだ付け時間	5s 以内/max.		
Soldering Time	SS 以内加ax.		
はんだ	Sn-3.0Ag-0.5Cu		
Solder	011-3.0/Ag-0.300		
注意事項 Caution	製品に直接こて先がふれないようにしてください。こて先が製品に直接触れて過剰な熱が加わった場合、圧電素子の特性劣化や製品電極の破損につながる恐れがあります。 Please do not directly touch the components with soldering iron, because the terminals of components or electrical characteristics may be damaged if excess thermal stress is applied.		

12-7-4 はんだ盛り量 Solder Volume

はんだ盛り量は基板の高さ以下にしてください。基板を超えた場合、キャップと基板の封 止部が破損する可能性があります。

Please keep the solder volume below the height of the substrate. When exceeding the substrate, the damage of sealing part between the metal cap and the substrate may occur.



13. 製品保管上の注意 Notice on product storage

13-1

温度-10~+40°C、相対湿度15~85%で、急激な温湿度変化のない室内で保管下さい。

Please store the products in room where the temperature / humidity is stable. And avoid such places where there are large temperature changes. Please store the products under the following conditions : Temperature : -10 to +40 °C

Humidity: 15 to 85% R.H.

13-2

製品保管期限は未開梱、未開封状態にて、納入後6ヶ月間です。納入後6ヶ月以内でご使用下さい。6ヶ月を越える場合ははんだ付け性等をご確認の上、ご使用下さい。

Expire date (Shelf life) of the products is 6 months after delivery under the conditions of an unopened package. Please use the products within 6 months after delivery.

If you store the products for a long time (more than 6months), use carefully because the products may be degraded in the solder-ability and/or rusty. Please confirm solder-ability and characteristics for the products regularly.

13-3

酸、アルカリ、塩、有機ガス、硫黄等の化学的雰囲気中で保管されますとはんだ付け性の劣 化不良等の原因となりますので、化学的雰囲気中での保管は避けて下さい。

Please do not store the products in a chemical atmosphere (Acids, Alkali, Bases, Organic gas, Sulfides and so on), because the characteristics may be reduced in quality, and/or be degraded in the solder-ability due to the storage in a chemical atmosphere.

13-4

湿気、塵等の影響を避けるため、床への直置きは避けて保管下さい。

Please do not put the products directly on the floor without anything under them to avoid damp places and/or dusty places.

13-5

直射日光、熱、振動等が加わる場所での保管は避けて下さい。

Please do not store the products in the places under direct sunlight, heat and vibration.

13-6

開梱、開封後、長期保管された場合、保管状況によっては、はんだ付け性等が劣化する可能性があります。開梱、開封後は速やかにご使用下さい。

Please use the products immediately after the package is opened, because the characteristics may be reduced in quality, and/or be degraded in the solder-ability due to storage under the poor condition.

13-7

製品落下により、製品内部の圧電素子の割れ等の原因となりますので、容易に落下しない状態での保管とお取扱いをお願い致します。

Please do not drop the products to avoid cracking of piezoelectric element.

	ocument no. 39049-4300B	P. 15/15
14	. <u>^</u> お願い Note:	
	14-1 ご使用に際しましては、貴社製品に実装された状態で必ず評価して下さい。 Please make sure that your product has been evaluated in view of your specifications with product being mounted to your product.	our
	14-2 当製品を当製品仕様書の記載内容を逸脱して使用しないで下さい。 You are requested not to use our product deviating from this product specification.	